

АНОМАЛЬНА ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПТИЧНОГО СТИРАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ РЕЛЬЄФНИХ ГРАТОК В ПЛІВКАХ АМОΡФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ

Трунов М.Л.

1. Постановка проблеми

Раніше було показано, що поверхневі рельєфні ґратки, які сформовані в плівках $As_{20}Se_{80}$ методом фотоіндукованого мас-транспорту, можуть стиратися однорідним лазерним променем із області краю поглинання ($\lambda=660$ nm), причому швидкість стирання залежить від інтенсивності лазера, його поляризації та періоду ґраток [1]. Подальші дослідження [2] виявили, що зміна амплітуди таких ґраток можлива і при їх опроміненні електронним променем, причому амплітудна залежність від періоду ґраток мала незвичайний характер: ґратки малих періодів стиралися, а великі – навпаки, збільшували свою амплітуду. Було висловлене припущення, що такий же ефект може мати місце і при опроміненні подібних ґраток однорідним лазерним променем, звичайно у випадку, якщо відповідні склади халькогенідного скла проявляють фотоіндукований мас-транспорт.

2. Мета роботи

Дослідження оптичного стирання поверхневих рельєфних ґраток, сформованих методом фотоіндукованого мас-транспорту в плівках $As_{20}Se_{80}$, в залежності від поляризації лазерного променя та періоду ґраток (1.5 – 15 мкм).

3. Результати і їх обговорення

Поверхневі рельєфні ґратки з періодом 1.5, 3.6, 7.5, 10, 12 та 15 мкм, формувалися на плівках $As_{20}Se_{80}$ товщиною 1 мкм, одержаних методом термічного випаровування, за звичайною голографічною схемою, при опроміненні р-поляризованим лазером запису (1) і підсвітці S-поляризованим лазером підсвітки (2) [див. схему на Рис.1 а, вставка (1) та часову послідовність включення відповідних лазерів на Рис.1 б, вставка]. Обидва лазери мали довжину хвилі 660 нм, яка відповідає краю поглинання скла $As_{20}Se_{80}$, та інтенсивність біля 350 мВт/см². Кінетика росту та стирання ґраток вимірювалася “in situ” за даними по зміні їх дифракційної ефективності, яка пропорційна квадрату висоти рельєфу h (для $h \ll \lambda$, де λ - довжина хвилі лазера зчитування). Після досягнення дифракційною ефективністю певного значення, лазер (1) виключався, а стирання ґратки здійснювалося променем лазера (2), поляризованого паралельно (p) або перпендикулярно (s) до вектору ґратки (див. Рис.1 а, вставки (2) і (3), відповідно). Дифракційна ефективність (у відносних одиницях) вимірювалася за допомогою волоконного спектрофотометру Ocean Optics USB 4000 та фіолетового лазера ($\lambda=404$ нм, $P=10$ мкВ) і дорівнювала інтенсивності променя в першому максимумі дифракції за схемою “на відбивання”.

Одержані результати можна узагальнити наступним чином: ґратки з періодом 1.5, 3.6 та 7.5 мкм стираються при опроміненні, як (p-), так і (s-) поляризованим променем. На Рис.1 а, як приклад, показано типові криві кінетики росту-стирання поверхневої ґратки з періодом 1.5 мкм. Ґратки, які мають період 10 мкм, не стираються променями вказаних поляризацій взагалі (Рис.1 б), а ґратка з періодом 15 мкм підсилюється р- поляризованим променем, досягаючи максимума дифракції (Рис.1 в, крива 2) і не стирається s- поляризованим (на Рис.1 в не показано). Такий же ефект було виявлено для ґратки з періодом 12 мкм, яка була

одержана без додаткової підсвітки (Рис. 1 г, криві 1 та 2, відповідно). Підсилення ґратки при опроміненні було чітко видно навіть в оптичному мікроскопі (Рис.1 д, див. виділений рельєф поверхні).

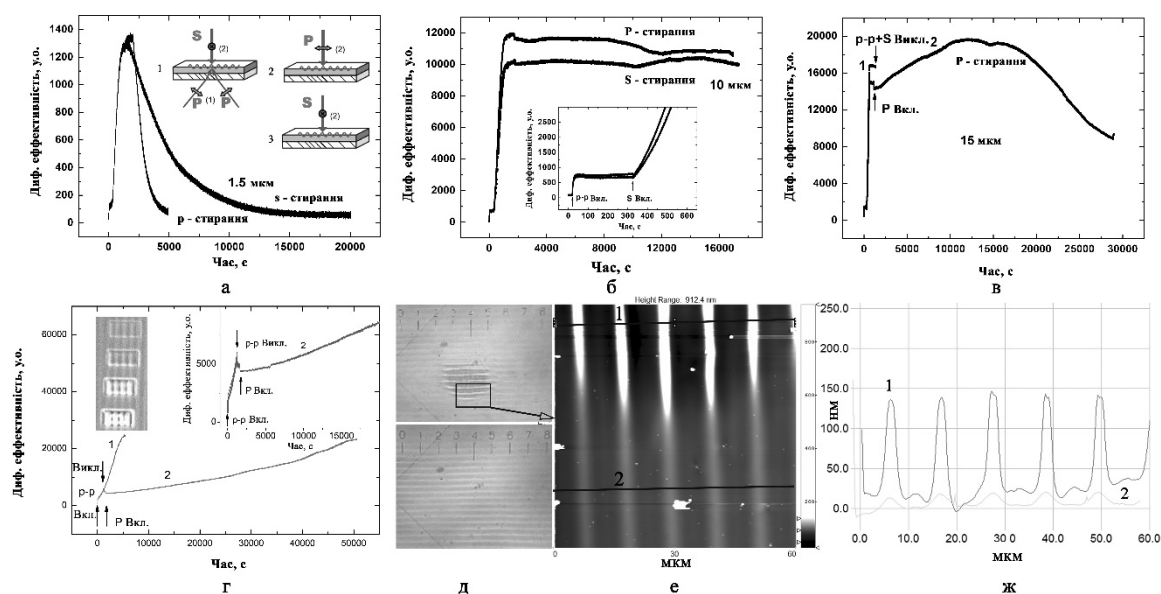


Рис.1. Типові криві кінетики стирання-росту поверхневих ґраток різних періодів на плівках $As_{20}Se_{80}$ (а-г) та оптичне (д) і АСМ (е) зображення поверхні вихідної та підсиленої ґратки з періодом 12 мкм. Амплітуда відповідних кривих (ж) відповідає перерізам 1 та 2 на АСМ скані (е). Період ґраток та поляризації відповідних променів вказано безпосередньо на Рис.1, а-в. На Рис.1 г, вставка ліворуч, для порівняння, приведено СЕМ зображення ділянок поверхньої ґратки з періодом 15 мкм, опроміненої електронним променем при різних експозиціях: чітко видно систематичне збільшення амплітуди ґратки із ростом експозиції (зверху вниз).

Аналіз висот початкової та підсиленої частини ґратки за допомогою АСМ (Рис.1, е) показав, що вони відрізняються майже в 8 разів: 16 нм проти 125 нм (Рис.1, ж). Додаткові експерименти виявили, що ґратка з періодом більше 10 мкм може бути підсилена навіть після дуже короткотривалого запису (1-2 хвилини). Отже, одержані результати (в частині стирання-підсилення) корелюють із такими, що отримані при опроміненні ґраток електронним променем (Рис.1 г, вставка ліворуч).

Аналіз відповідних перерізів поверхневих рельєфів показав, що їх амплітуда h змінюється із часом опромінення лазером (2) за експоненціальним законом, тобто $h(t) = h_0 \exp(-k_{p,s} \cdot t)$, де h_0 – початкова амплітуда, а $k_{p,s}$ - коефіцієнти стирання/підсилення для вказаних вище поляризацій, які є позитивними для ґраток малих періодів і від'ємними для ґраток великих періодів (очевидно, що у випадку відсутності стирання/підсилення вони дорівнюють 0).

4. Висновки

Виявлена аномальна залежність оптичного стирання поверхневих рельєфних ґраток в аморфних халькогенідах від їх періоду. В роботі розглянуті можливий механізм та практичне застосування виявлених вище закономірностей.

1. Yu. Kaganovskii, M.L. Trunov, D.L. Beke, and S. Kökényesi “ Mechanism of photo induced mass transfer in amorphous chalcogenide films” *Mater. Lett.* **66** (2011) 159–161.
2. Yu. Kaganovskii, M.L. Trunov, C. Cserhati, P.M. Lytvyn, D.L. Beke, and S. Kökényesi “Electron beam induced variation of surface profile in amorphous $\text{As}_{20}\text{Se}_{80}$ films” *J. Appl. Phys.* **115** (2014) 183512:1-8.